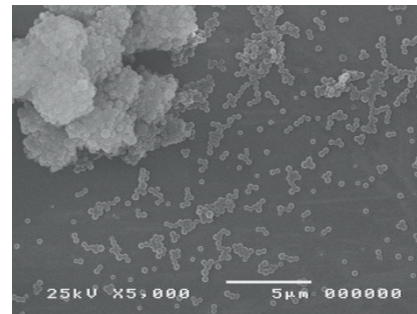


走査型電子顕微鏡



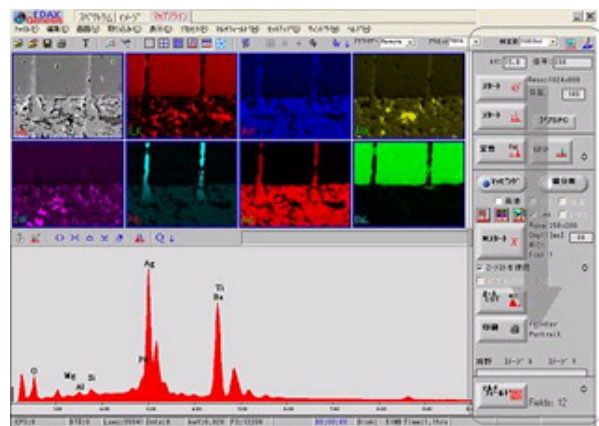
- 料金表コード** P01
商品名 走査型電子顕微鏡
メーカー名 株式会社 日立ハイテクノロジーズ
型式 S-3000N
取得年月 1999年10月(H11年度競輪補助物件)
仕様
 ・倍率:30~30万倍
 ・加速電圧:0.5~30kV
 ・真空モード:高真空、低真空(1~270Pa)
 ・検出器:二次電子・反射電子検出器
 ・エネルギー分散型X線分光器付き 検出元素:Be~U



観察したナノサイズ粒子

用途・使用例

- ・試料表面の形状や凹凸の様子、比較的表면에近い部分の内部構造の観察。
- ・樹脂等の絶縁体試料も測定可(低真空モード)。
- ・試料観察と同時に、元素分析が行えます(X線分光器 S01)。また、マッピング測定も可能です。
- ・破断面観察や、異物分析等に利用できます。



マッピング測定による表面の元素分布